

JIS

光ファイバ用光パワーメータ試験方法

JIS C 6184 : 2024

(JSA)

令和 6 年 7 月 22 日 改正

認定産業標準作成機関 作成・審議

(日本規格協会 発行)

一般財団法人日本規格協会 電子分野産業標準作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	平 本 俊 郎	東京大学
(委員)	石 井 紀 彦	日本放送協会
	河 村 真紀子	主婦連合会
	西 城 武 志	総務省国際戦略局
	渋 谷 隆	株式会社白山
	諏 訪 正 樹	KOA 株式会社
	内 藤 恵美子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサル タント・相談員協会
	藤 井 哲 郎	東京都市大学名誉教授
	松 井 隆	日本電信電話株式会社
	山 田 誠	大阪公立大学

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 5.10.1 改正：令和 6.7.22

担 当 部 署：経済産業省イノベーション・環境局 国際電気標準課

(〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1)

官 報 掲 載 日：令和 6.7.22

認定産業標準作成機関：一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-11-28 三田 Avanti)

素 案 作 成 者：一般財団法人光産業技術振興協会

(〒112-0014 東京都文京区関口 1-20-10 住友江戸川橋駅前ビル)

審 議 委 員 会：電子分野産業標準作成委員会 (委員長 平本 俊郎)

この規格についての意見又は質問は、上記認定産業標準作成機関又は素案作成者にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに見直しが行われ速やかに確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
4 試験条件	2
4.1 一般事項	2
4.2 試験準備	2
4.3 標準試験条件	2
4.4 光ファイバ用光源	2
4.5 測定用光ファイバ	3
5 試験の概要	3
5.1 試験の条件及び項目	3
5.2 不確かさの算出方法	3
5.3 確度の算出方法	4
6 標準試験条件における不確かさ及び確度の試験	5
6.1 概要	5
6.2 試験手順	5
7 動作条件における試験	6
7.1 概要	6
7.2 直線性	7
7.3 波長依存性	9
7.4 偏光依存性	9
7.5 NA 依存性	10
7.6 多重反射依存性	11
7.7 ゼロドリフト	11
7.8 温度依存性	12
7.9 照射時の安定性	12
8 過負荷試験	12
9 強度試験	13
9.1 強度試験の概要	13
9.2 振動試験	13
9.3 落下試験	13
附属書 A (規定) 不確かさの規定	14
解 説	18

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、認定産業標準作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、JIS C 6184:1993 は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

光ファイバ用光パワーメータ試験方法

Test methods of fiber optic power meters

1 適用範囲

この規格は、光コネクタ端子をもち波長範囲 400 nm～1 800 nm の光パワーを測定することが可能な検出器を備えた光ファイバ用光パワーメータの試験方法について規定する。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS C 1002 電子測定器用語

JIS C 6186 光ファイバ用光パワーメータ校正方法

JIS C 6188 測定用光減衰器校正方法

JIS C 6820 光ファイバ通則

JIS C 6830 光ファイバコード

JIS C 6831 光ファイバ心線

JIS C 6832 石英系マルチモード光ファイバ素線

JIS C 6835 石英系シングルモード光ファイバ素線

JIS C 60068-2-6 環境試験方法－電気・電子－第 2-6 部：正弦波振動試験方法（試験記号：Fc）

JIS C 60068-2-31 環境試験方法－電気・電子－第 2-31 部：落下試験及び転倒試験方法（試験記号：Ec）

JIS Z 8103 計測用語

JIS Z 8120 光学用語

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次によるほか、JIS C 1002、JIS C 6186、JIS C 6820、JIS Z 8103 及び JIS Z 8120 による。

3.1

受光面

検出器の入力部分において、光の検出に有効な領域